

Wykład 2

sobota, 2 grudnia 2017 11:16

KLASA NARZĘDZIA POMIAROWEGO

- jest to liczba większa od błędu podstawowego

$$kl \geq |\pm \delta, X| = \left| \frac{\pm \Delta_p X}{X_p} \cdot 100 \right| \rightarrow \text{im mniej, tym lepiej}$$

- w zależ. od rodz. narzędzi pomiarowego X_p przyjmuje wartości:

1. $kl \rightarrow X_p = \text{zakres pom. } 0,5$
2. $\textcircled{1} \quad X_p = \text{wartość wskazana } \textcircled{1}$
3. $\textcircled{2} \quad X_p = \text{dt. taktu podziątki } \textcircled{2}$
4. $|kl| \quad X_p \rightarrow 1. \quad \text{ograniczony obszar pom.}$

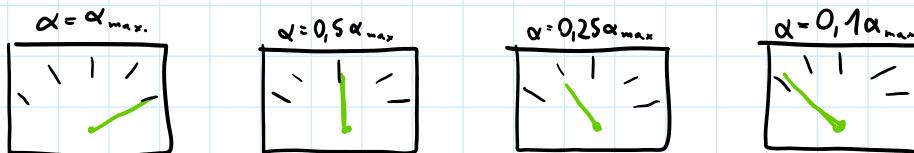
OBŁ. BL. SYSTEMATYCZNYCH

- Bl. syst. są spowodowane błędami narzędzi pom., stosowanych w procesie pomiaru, zatem:
wzorców, przetworników, przyrządów pomiarowych

BL. POMIARU BEZPOŚREDNIEGO

- wynika z bl. dokładności zast. przyrządu pomiarowego oraz wartości pomiarowanej wielkości

Przyjmijmy, że $kl = 0,5$.



$$\delta X = kl = 0,5\% \quad \delta X = 2kl = 1\% \quad \delta X = 4kl = 2\% \quad \delta X = 10kl = 5\%$$

$$\delta X = \frac{\Delta X}{X_m} \cdot 100 = kl. \cdot \frac{X_m}{X_z}$$

$X_z - X_{\text{zmierzane}}$ $X_m - X_{\text{maksymalne}}$

Wniosek: Zawarte należy mierzyć na właściwych zakresach pomiarowych

Zadanie 1: Na rezystorze dekadowym nastawiono rezystancję 15Ω na dekadach.

$$R_D = R_{D_1} + R_{D_2} = 5 \times 1\Omega + 1 \times 10\Omega = 15\Omega$$

$$kl_{1\Omega} = 0,5\% \quad kl_{10\Omega} = 0,1\%$$

Znaleźć graniczny błąd względny nastawienia zadanej wartości rezystancji.

$$\Delta R_{1\Omega} = \frac{R \cdot kl}{100} = \frac{15\Omega \cdot 0,5}{100} = 0,025\Omega$$

$$\Delta R_{10\Omega} = \frac{R \cdot kl}{100} = \frac{15\Omega \cdot 0,1}{100} = 0,015\Omega$$

$$\Delta R_{15\Omega} = \Delta R_{1\Omega} + \Delta R_{10\Omega} = 0,025\Omega + 0,015\Omega = 0,04\Omega$$

$$\delta R_{15\Omega} = \frac{\Delta R_{15\Omega}}{R_{15\Omega}} \cdot 100 = \frac{0,04\Omega}{15\Omega} \cdot 100 = 0,27\%$$

BŁĄD SYST. POMIARU POŚREDNIEGO

- pomiar pośredni określa zależność

$$X = f(A, B, C, \dots)$$

- wyznaczenie wartości wielkości mierzanej X wymaga bezpośredniego zmierzania wielkości pośrednich, przy czym każdy z tych pomiarów pośrednich wykonywany jest z określonym błędem ($\Delta A, \Delta B, \Delta C, \dots$)

- wynik i błąd pomiaru są funkcją wyników i błędów pomiarów wielkości pośrednich

$$X \pm \Delta X = f(A \pm \Delta A, B \pm \Delta B, C \pm \Delta C)$$

- wielkość całkowitego błędu pomiaru $\pm \Delta X$ określa się z różniczką zupełną, która daje wystarczające przybliżenie

$$\pm \Delta X = \frac{\partial X}{\partial A} \Delta A + \frac{\partial X}{\partial B} \Delta B + \frac{\partial X}{\partial C} \Delta C + \dots$$

- ponieważ nie znamy wartości błędów, a znamy przedziały błędów, to powyższą zależność zapisujemy w postaci

$$\pm |\Delta X| = \pm \left(\left| \frac{\partial X}{\partial A} \Delta A \right| + \left| \frac{\partial X}{\partial B} \Delta B \right| + \dots \right)$$

i nazywamy bezwzględnym błędem granicznym

- względny błąd graniczny określa wzór:

$$\delta_g X = \pm \left| \frac{\Delta g X}{X} \right| \cdot 100$$

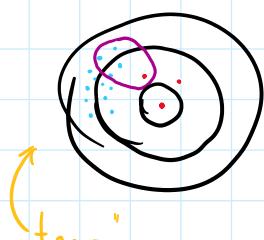
który daje zawartą wartość błędu

- ponieważ błędy systematyczne w pomiarach pośrednich poszczególnych wielkości mierzonych układają się losowo i niezależnie (nie ma korelacji), to błąd niespodkowy trzeba czasem określić tak samo jak błąd przypadkowy

$$\pm \Delta_{gs} X = \sqrt{ \left(\left(\frac{\partial X}{\partial A} \right)^2 (\Delta A)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial B} \right)^2 (\Delta B)^2 + \dots \right) }$$

- tak zdefiniowany błąd nazywa się błędem granicznym statystycznym

$$\delta_g X = \pm \left| \frac{\Delta g X}{X} \right| \cdot 100$$



WW błąd statystyczny

WW omyłka

WW grupa pomiarowa

WW żr. błąd systemat.



M. źr. bl. systemat.

TEORIA BŁĘDÓW

- jest dziś powszechnie stosowana do wyznaczania wskaźnika klasy wzorców, przyrządów pomiarowych i przetworników.
- nie stosuje się jej do wyzn. błędów pomiarów

TEORIA NIEPEWNOŚCI

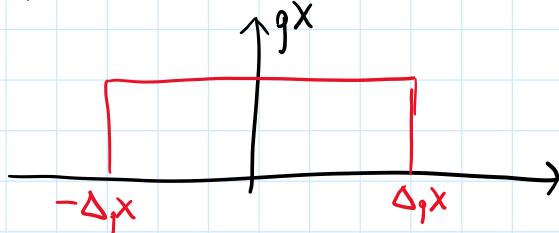
- teoria niepewności przyjmuje losowy rozkład niedokładności.
- niepewność - rozrzuł wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej
- NIEPEWNOŚĆ - wartość za znakiem \pm w wyniku pomiaru
- Niepewność pomiaru charakteryzuje się przez podanie:
 - niepewn. standardej
 - niepewn. złożonej
 - niepewn. rozszerzonej
- Niepewność standarodowa $v(X)$ jest wyrażona przez odchylenie standarodowe wyników szeregów pomiarów wykonanych w niezmiennych warunkach
- Niepewność złożona $U_t(X)$ obejmuje niepewności standarodowe wyników pomiarów spowodowane przez efekty przypadkowe U_a i systematyczne U_b

$$U_t(X) = \sqrt{U_a^2 + U_b^2}$$

- Niepewność rozszerzona określa przedział wartości wokół wyników pomiarów :

$$U(X) = k_p \cdot U_t(x)$$

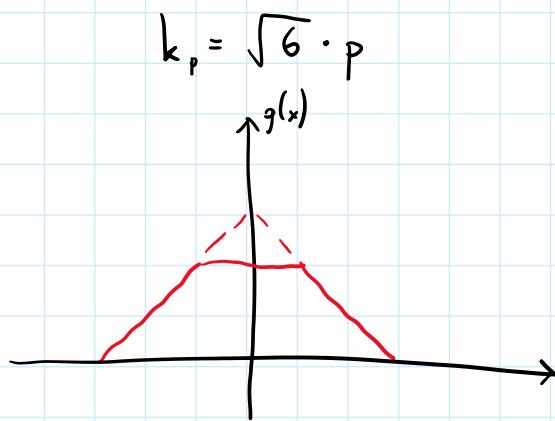
- wsp. wzroszenia k_p jest powiązany z poziomem ufności p
- Przy analizie niepewności pomiaru typu A i typu B zaktabia się, że wszystkie znane poprawki zostaną uwzględnione w wyniku pomiaru
- OCENA NIEP. TYPU B
 - niep. typu B jest wywodzona przez efekty systematyczne.
 - mierzonej wielkości przyporządkowuje się rozkład prawdopodobieństwa i oblicza odchylenie stand.
 - niepewności typu B wynikają z niedokładn. aparatury pomiarowej
 - rozkład błędów może być różnorodny, najczęściej jest jednostajny, lub dowolny inny, wskazany przez producenta



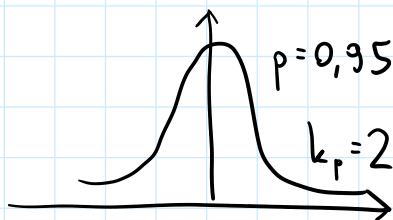
$$\square U_g(X) = \frac{\Delta g X}{\sqrt{3}} \rightarrow \text{rozkt. kwadratowy}$$

$$1 \quad U_g(X) = \frac{\Delta g X}{\sqrt{6}} \rightarrow \text{rozkt. trójkątny}$$

- pomiar bezpośredni $k_p = \sqrt{3} \cdot p$;
- poziom ufności p w 98% wynosi $p = 0,95$
 - > jeśli w zadaniu nie ma podanej innej wartości, przyjmujemy, że $p = 0,95$
- pomiar pośredni: jeśli mam 2 przykazy tego samego typu nast. na te same zakresy pomiarowe, to rozkład jest trójkątny. W tym przypadku



- w przypadku, gdy mamy 2 różne przyrzядy lub min. 3 przyrzady taki same, to rozkład wyników przyjmujemy za rozkład Gaussa:



- obliczanie niepewności typu B dla przyrzadów analogowych:

Woltomierzem analogowym o $k_1 = 0,5$ $U_n = 75V$; $\alpha_{max} = 150 \text{ dz}$. odczytano wartość wykhylenia $\alpha = 114,2 \text{ dz}$.

Oblicz wynik pomiaru i niepewność względna dla poziomu ufności $p = 0,95$

$$U = C_V \cdot \alpha \quad C_V = \frac{U_n}{\alpha_{max}} \left[\frac{V}{\text{dz}} \right]$$

$$U = \frac{U_n}{\alpha_{max}} \cdot \alpha = \frac{75V}{150 \text{ dz}} \cdot 114,2 = 57,1 V$$

$$\Delta_0 \alpha = 0,2 \text{ dz}$$

$$\Delta_0 U = \Delta_0 \alpha \cdot C_V = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1 V$$

$$U_B(U) = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}} = \frac{k_1 \cdot U_n}{100\sqrt{3}} = \frac{0,5 \cdot 0,75}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,375 V$$

$$U(U) = k_p \cdot U_B(U) = \sqrt{3} \cdot 0,095 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,375 V = 0,356 V$$

$$\text{Odp: } U \pm U(U) = (57,1 \pm 0,4) V$$

$$U_r(U) = \frac{U(U)}{U} \cdot 100 = \frac{0,356}{57,1} \cdot 100 = 0,62 \%$$

- nauka zapisu wyniku pomiaru:

1) zaokrąglamy zgodnie z zasadami matematyki

- do 5 w dół,

- od 5 w górę

- $5 \rightarrow$ piszemy „równie 5 do parzystej”

2) niepewność pomiaru zaokrąglamy do 2 cyfr znaczących

- cyfry znaczące liczby:

$$1000 \rightarrow \cancel{1 \cdot 10^3} \rightarrow 1,000 \cdot 10^3$$

$$1000,00 \rightarrow \cancel{1 \cdot 10^6} \rightarrow 1,000000 \cdot 10^3$$

$$0,001 \rightarrow 1 \cdot 10^{-3} \quad \text{OK}$$

$$138,54 \rightarrow 0,14 \cdot 10^3$$

$$0,01285 \rightarrow 13 \cdot 10^{-3}$$

3) niepewność pomiaru zapisujemy z 1 cyfrą znaczącą w przypadku, gdy rozdzielcość pomiaru nie pozwala nam zapisać z 2 cyframi znaczącymi.

niepewność zaokrąglamy w górę, chyba że błęd wynikający z zaokrąglenia niepewności w dół nie przekroczy 10% wartości zaokrąglanej

4) liczba miejsc po przecinku wartości odczytanej i niepewności pomiaru musi być taka sama.

KOLOS: niepewność, przyrzekają anal. i cyfr.